EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

2000315326

PUBLICATION DATE

14-11-00

APPLICATION DATE

06-05-99

APPLICATION NUMBER

11125881

APPLICANT: ROHM CO LTD;

INVENTOR: OYABU HIROSHI;

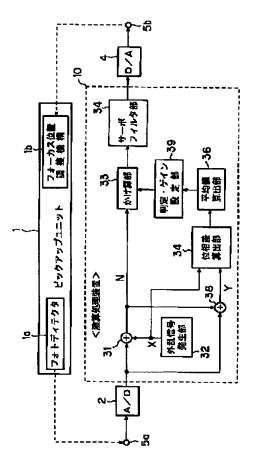
INT.CL.

: G11B 7/09

TITLE

OPTICAL DISK REPRODUCING

DEVICE



ABSTRACT: PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an optical disk reproducing device capable of automatically adjusting the loop gain of servo control essentially to 0 dB in accordance with the characteristics of a pickup unit.

> SOLUTION: The phase difference is detected between the formed value X of a disturbance signal as one part, which is obtainable in accordance with the two expressions N=X+N.G and Y=N+N.G (where G is a transfer function in the path until the synthesis value N is detected as a position error detecting signal), and the above signal value Y as the other part; also, a gain at which this phase difference essentially becomes 90° is set as a loop gain; as a result, the loop gain of servo processing can be essentially set at 0 dB; therefore, merely by forming the disturbance signal for the signal value X of the frequency the loop gain of which is desired to be 0 dB essentially, and by determining the gain at which the phase difference is essentially 90°, the loop gain in the servo processing can be set in accordance with the characteristics of an employed pickup unit.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-315326 (P2000-315326A)

(43)公開日 平成12年11月14日(2000.11.14)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

ァーマコート*(参考)

G11B 7/09

C11B 7/09

A 5D118

審査請求 未請求 請求項の数3 〇L (全 8 頁)

(21)出顧番号

(22) 川瀬日

特願平11-125881

平成11年5月6日(1999.5.6)

(71)出願人 000116024

ローム株式会社

京都府京都市右京区西院灣崎町21番地

(72)発明者 河田 祐一

京都市右京区西院溝崎町21番地口一厶株式

会社内

(72)発明者 大薮 博司

京都市右京区西院溝崎町21番地口一厶株式

会社内

(74)代理人 100079555

弁理士 梶山 佶是 (外1名)

Fターム(参考) 5D118 AA06 BA01 BB02 CA02 CA03

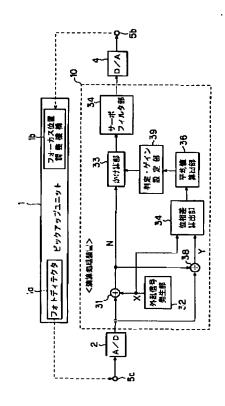
CA04 CB03 CD02 CD03 CD08

(54) 【発明の名称】 光ディスク再生装置

(57)【要約】

【課題】ビックアップユニットの特性に対応してサーボ制御のループゲインを実質的にOdBに自動的に調整することができる光ディスク再生装置を提供することにある。

【解決手段】N=X+N+GとY=N+N+Gとの2式(ただし、Gは、合成値Nが位置エラー検出信号として検出されるまでの経路における伝達関数)に従って得られる外乱信号の生成値Xと、前記の信号値Yの位相差を検出し、この位相差が実質的に90° になるゲイン値をループゲインとして設定すれば、サーボ処理のループゲインを実質的に0 d Bに設定できるので、ループゲインを実質的に0 d Bにしたい周波数の信号値Xの外乱信号を生成し、位相差が実質的に90° になるゲイン値を求めるだけで、そのときどきのピックアップユニットの特性に対応したサーボ処理におけるループゲインの設定が可能になる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】レーザ光源と受光素子とを有し、光ディス クに対して前記レーザ光源によるレーザ光を照射して前 記光ディスクからの反射光を前記受光素子が受けて前記 光ディスクの照射面に対する前記レーザ光の焦点合わせ 位置あるいはトラッキング位置についての位置エラー検 出信号を発生するピックアップユニットと、このピック アップユニットから前記位置エラー検出信号を受けてA /D変換して前記位置エラー検出信号のデジタル値に対 して前記ピックアップユニットを含めてサーボループを 構成してこのサーボループに所定のループゲインを設定 して位置エラーを修正するサーボ処理を行い、その処理 結果をD/A変換して前記照射面に対する前記レーザ光 の位置エラーを修正する修正信号を発生する制御装置と を有し、前記修正信号に応じて前記レーザ光の前記照射 面に対して前記レーザ光を焦点合わせしあるいはトラッ キングする光ディスク再生装置において、

前記制御装置は、内部で外乱信号を生成し、前記位置エラー検出信号のデジタル値Dと前記外乱信号の生成値Xとを合成して合成値Nを生成し、この合成値Nに対して前記サーボ処理を行うものであり、

次の2つの関係式

N = X + D

Y = N + D

を成立させる関係にある前記生成値Xと前記信号値Yの位相差を検出し、この位相差が実質的に90°になるゲイン値を前記ループゲインとして設定することを特徴とする光ディスク再生装置。

【請求項2】さらに、前記制御装置は、前記位置エラー 検出信号のデジタル値Dと前記合成値Nとを合成して前 記信号値Yを生成する合成手段と、前記生成値Xと前記 信号値Yとの位相を比較して位相差を算出する位相差算 出手段と、この位相差算出手段から得られる位相差算出 結果を複数回得て、この複数回の前記位相差算出結果の 平均値を算出する平均値算出手段と、前記平均値が実質 的に90°の位相差か否か判定する判定手段と、この判 定手段の判定の結果、前記平均値が実質的に90°でな いときに前記ループゲインのゲイン値を増減設定するゲ イン設定手段とを備え、前記サーボ処理は、フォーカス サーボのためのサーボフィルタ処理であり、前記修正信 号は、前記ピックアップユニットから出力されるレーザ 光を焦点合わせする焦点合わせ機構に加えられるもので あり、前記判定手段の判定により前記平均値が実質的に 90°になるゲイン値を検出する請求項1記載の光ディ スク再生装置。

【請求項3】さらに、前記サーボループにおいて前記合成値Nに係数をかけることでゲイン値を設定するかけ算手段を有し、前記ゲイン設定手段は、前記かけ算手段に最初に設定したゲイン値に対してその上位 n ビット (n は3以上の整数) について前記位相差算出結果に応じて

インクリメントあるいはディクリメントして前記平均値が実質的に90°になるゲイン値を検出するものである請求項2記載の光ディスク再生装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、光ディスク再生 装置に関し、詳しくは、ピックアップユニットの特性に 対応してサーボ制御のループゲインを実質的に 0 d B に 自動的に調整することができる光ディスク再生装置に関 する。

[0002]

【従来の技術】近年、CD-ROM装置にあっては、1 倍速から32倍速まで、そのデータ読出し速度が急速に 高速化され、そのために、1倍速から32倍速までの速 度範囲でデータの読出しが要求されている。また、光ディスク記憶装置においても、その記憶密度は、2倍、4 倍、6倍、8倍…と急速に増加してきている。この種の 光ディスク再生装置では、非常に高精度なフォーカシン グサーボ制御が要求され、そのためにフォーカスサーボ ループゲイン調整が必要になる。

【0003】CDの再生装置のフォーカシングサーボ機 構は、ピックアップユニットにおいて、4分割フォトデ ィテクタ (ピックアップ)で、CDからの反射光を受け てフォーカス位置エラー生成回路により各受光エリアの トータル受光量についての検出信号であるRF検出信号 と、対向する受光エリアの検出信号の和について相互の 差を採った検出信号である位置エラー検出信号FEとを 発生させる。そして、RF検出信号のレベル検出により ジャストフォーカス制御範囲に入ったか否かが検出され る。RF検出信号がジャストフォーカス制御レベルにな ると、アナログ制御では、ピックアップユニットと、フ ォーカス位置エラー生成回路におけるアンプ (あるいは) ゲイン調整用アンプ)、サーボフィルタ、そしてビック アップユニットのフォーカス位置調整機構(レンズ移動 機構)とからなるフォーカスサーボループが形成され、 位置エラー検出信号FEがゼロとなるように自動的に制 御されて光ディスクの照射面がレーザ光の合焦点位置と なるようにビックアップユニットから出力される前記の レーザ光の焦点合わせが行われる。この焦点合わせとし ては、例えば、フォーカス位置調整機構においてレーザ 光の光路に挿入されたレンズの焦点合わせ位置への移動 による。同様なことがデジタル制御においても行われ、 デジタル制御では、前記に対応する各回路の機能に対応 する処理がMPUにより所定のプログラムが実行されて 実現される。そして、位置エラー検出信号FEがゼロと なるような信号値がエラー修正値として算出され、これ がD/A変換回路によりアナログ値に変換され、光ディ スクの照射面にレーザ光が合焦点するように変換された アナログ信号をフォーカス位置調整機構に駆動信号とし て送出する。

【0004】図5は、後者のデジタル制御における従来 のフォーカスサーボループゲイン調整における制御装置 (コントローラ)の内部処理を機能ブロック化した説明 図である。なお、このフォーカスサーボループゲイン調 整は、通常、光ディスク再生装置の電源がONにされた ときに、その都度、自動的にゲイン調整に入り、ゲイン 設定がなされる。図5において、1は、外部部品として のピックアップユニットであり、ピックアップユニット 1のフォトディテクタ1aから得られた検出信号(位置 エラー検出信号FE)を入力端子5aを介してA/D変 換回路(A/D)2で受けて、A/D変換をして入力信 号値Y(デジタル値)を得て、これを演算処理装置3に 入力する。演算処理装置3は、その機能ブロックとし て、デジタル値に変換された入力信号値Yを信号合成部 31で外乱信号発生部32により生成された信号値X (デジタル値)と合成し、かけ算部33に入力する。か け算部33は、フォーカスサーボループゲインを決定す る回路に相当するものであり、合成信号Nに係数K(ゲ イン)をかけた値をサーボフィルタ部34に送出し、位 置エラーを修正するためのサーボフィルタ処理をしてそ の結果得られる位置エラー修正値をD/A変換回路4に 送出する。D/A変換回路4の出力は、出力端子5bを 介してピックアップユニット1のフォーカス位置調整機 構1b(レンズ移動機構)のドライブアンプに駆動信号 として加えられる。なお、ここでの演算処理装置3の各 機能は、MPJJがメモリに記憶された各機能に対応する 処理プログラムを実行することで実現されるものであ **- り、各信号値は、メモリの作業エリアに算出値として記** 憶され、処理されていく。

【0005】ここで、外乱信号発生部32は、アナログ 制御の場合の外乱信号発生回路に対応し、ピックアップ ユニット1の4分割フォトディテクタの4分割されたセ ンサエリアの感度のアンバランス量を推定してこのアン バランス量に対応するオフセットを発生するための信号 を得るために設けられているものである。外乱信号発生 部32とサーボ制御との関係を説明すれば、外乱信号発 生部32は、例えば、1kHz程度の三角波を外乱信号 値Xとして発生する。この外乱信号値Xは、信号合成部 31を経て位置エラー検出信号値Yに加えられ、かけ算 部33を経てサーボフィルタ部34に送出され、ドライ ブアンプによりフォーカス位置調整機構1bが制御され てビックアップユニット1からの発生するレーザ光の焦 点位置が微少に上下移動して、そのときのRF検出信号 の応答波形によりオフセットが算出される。なお、RF 検出信号関係については今回の発明とは直接関係してこ ないので図では省略してある。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ここで、前記のようなフォーカスサーボループにおいては、フォーカスサーボループゲインを実質的にOdBに調整することが必要で

ある。それは、かけ算部33の係数値Kの値(ゲイン値)を決定することで行われるが、従来は、信号値Yと信号値Xの位相差を位相差算出部34に入力して位相差を算出し、その比較結果の平均値を平均値算出部36で採って、算出した平均値に対してループゲインが0dBになるような基準位相範囲にあるか否かを判定・ゲイン設定部37で判定して、この判定の結果において位相が基準範囲にないときに判定・ゲイン設定部37がかけ算部33の係数値K(ゲイン値)を変更する。ことによりサーボループゲイン値を変更して次の判定を行い、基準位相範囲になるような位相差を得ることで最適なゲイン値(係数値K)を設定する処理をするものである。

【0007】しかし、このような判定は、得られた位相と基準範囲とを比較することによるので、範囲という幅をもってゲイン設定が行われる。そのため正確なゲイン設定ができない問題がある。しかも、基準範囲は、接続されるピックアップユニットの特性に応じて決定されるので、ピックアップユニットの特性が変更されたり、他の種類のビックアップユニットが装着された場合には改めて適正な位相差の基準範囲を測定により求めなければならない欠点がある。この発明の目的は、このような従来技術の問題点を解決するものであって、ピックアップユニットの特性に対応してサーボ制御のループゲインを実質的に0dBに自動的に調整することができる光ディスク再生装置を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】このような目的を達成す るための発明の光ディスク再生装置の特徴は、レーザ光 源と受光素子とを有し、光ディスクに対してレーザ光源 によるレーザ光を照射して光ディスクからの反射光を受 光素子が受けて光ディスクの照射面に対するレーザ光の 焦点合わせ位置あるいはトラッキング位置についての位 置エラー検出信号を発生するビックアップユニットと、 このピックアップユニットから位置エラー検出信号を受 けてA/D変換して位置エラー検出信号のデジタル値に 対してピックアップユニットを含めてサーボループを構 成してこのサーボループに所定のループゲインを設定し て位置エラーを修正するサーボ処理を行い、その処理結 果をD/A変換して照射面に対するレーザ光の位置エラ ーを修正する修正信号を発生するコントローラとを有 し、修正信号に応じてレーザ光の照射面に対してレーザ 光を焦点合わせしあるいはトラッキングする光ディスク 再生装置において、コントローラが、内部で外乱信号を 生成し、位置エラー検出信号のデジタル値Dと外乱信号 の生成値Xとを合成して合成値Nを生成し、この合成値 Nに対してサーボ処理を行うものであり、次の2つの関 係式

N = X + D

Y = N + D

を成立させる関係にある生成値Xと信号値Yの位相差を

検出し、この位相差が実質的に90°になるゲイン値を ループゲインとして設定するものである。

[0009]

【発明の実施の形態】このように、N=X+DとY=N +D(ただし、D=N・Gであり、Gは、合成値Nが位 置エラー検出信号として検出されるまでの経路における 伝達関数)に従って得られる生成値Xと信号値Yの位相 差を検出し、この位相差が実質的に90°になるゲイン 値をループゲインとして設定すれば、後述する(3)式、 (4)式により理解できるように、サーボ処理のループゲ インを実質的に0dBに設定できる。したがって、ルー プゲインを実質的に0dBにしたい周波数の信号値Xの 外乱信号を生成し、位相差が実質的に90°になるゲイ ン値を求めるだけで、そのときどきのピックアップユニ ットの特性に対応したサーボ処理におけるループゲイン の設定が可能になる。その結果、ピックアップユニット の特性に合わせて基準範囲を設定することがが不要にな り、ピックアップユニットの特性に影響されることなる く、レーザ光の位置をサーボ処理で修正してレーザ光を 照射面に焦点合わせをすることも、あるいはトラッキン グさせることも容易にできる。また、生成値Xと信号値 Yの位相差が実質的に90°になるゲイン値をサーボ制 御のループゲインとして選択する場合においては、ルー プゲインを決定するかけ算手段に最初に設定したゲイン 値に対してその上位 n ビット (nは3以上の整数) に対 して位相差算出結果に応じてインクリメントあるいはデ ィクリメントをして実質的に90°になるゲイン値を検 出するようにすれば、設定するゲイン値の変動幅を小さ くでき、サーボループ外れを抑制することができる。

[0010]

【実施例】図1は、この発明の光ディスク再生装置を適 用した光ディスク再生装置のフォーカスサーボループゲ イン調整におけるコントローラの内部の機能ブロック 図、図2は、図1のフォーカスサーボループゲイン調整 におけるコントローラの説明図、図3は、ゲイン設定処 理のフローチャート、図4は、ゲイン設定処理における ゲイン値選択の説明図である。なお、図5と同一の構成 要素は、同一の符号で示し、その説明を割愛する。図1 においては、図5の機能ブロックにおいてさらに信号合 成部38が追加され、これにより位相差を比較する信号 値Yが次の(2)式の関係において生成される。また、図 1では、図5の判定・ゲイン設定部37に換えて判定・ ゲイン設定部39が設けられている。これらの点で、図 5のものとこの実施例とが相違する。なお、信号合成部 38は、図5の信号合成部31の入力信号である、位置 エラー検出信号のデジタル値D(=N・G)とその出力 信号である合成信号値Nとの加算値を位相差比較の信号 値Yとして得る。

【0011】ここで、ビックアップユニット1を含めたフォーカスサーボループのゲインをG(Gは、合成値Nが位置エラー検出信号として検出されるまでの経路における伝達関数)としたときに、信号合成部31による合成信号値Nと外乱信号発生部32から出力される信号値Xと前記の信号合成部38により得られる信号値Yとの間に次の関係式を成立させるものである。

$$N = X + N \cdot G \cdot \cdots (1)$$

$$Y = N + N \cdot G \qquad \cdots (2)$$

その結果として、ここでは、0 d Bのサーボ制御のループフィルタのゲイン調整として位相差が実質的に90°になる点を検出すれば済む。

【0012】その理由は、次の通りである。なお、次の式において

伝達関数 $G = g + e^{-j\theta}$ (3) とする。

$$\begin{split} &Y/X \!=\! (1+G)/(1+G) \!=\! (1+g\cdot e^{-j\theta})/(1-g\cdot e^{-j\theta}) \\ &=\! (1+g\cdot \cos\theta - j\cdot g\cdot \sin\theta)/(1-g\cdot \cos\theta + j\cdot g\cdot \sin\theta) \\ &=\! (1+g\cdot \cos\theta - j\cdot g\cdot \sin\theta)\cdot (1-g\cdot \cos\theta - j\cdot g\cdot \sin\theta)/A \\ &=\! \{(1+g\cdot \cos\theta)\cdot (1-g\cdot \cos\theta) \!-\! (g\cdot \cos\theta)^2 \!-\! j\cdot 2\,g\cdot \sin\theta\}/A \\ &=\! \{(1-g^2) \!-\! j\cdot 2\,g\cdot \sin\theta\}/A \\ &\hbar \mathcal{E} \mathsf{U}, \end{split}$$

 $A = (1 - g \cdot \cos \theta + j \cdot g \cdot \sin \theta) \cdot (1 - g \cdot \cos \theta + j \cdot g \cdot \sin \theta)$

これにより信号値Xと信号値Yの位相関係は、

 $\phi = -\tan^{-1}\{(2g \cdot \sin\theta)/(1-g^2)\}$ …………(4) 【 $0 \cdot 0 \cdot 1 \cdot 3$ 】そこで、(3)式においてg = 1 になるようにサーボ制御のループフィルタゲインを設定する調整をするには、(4)式において、g = 1 と置くと、信号値X と信号値Y差の位相 ϕ は、 $-\tan^{-1}\{(2g \cdot \sin\theta)/(1-g^2)\}$ が一 ∞ なり、 $\phi = 9 \cdot 0$ 0° となる。その結果、ここでは、ゲインを変化させてg = 1 になる点は、ゲインを変化させて信号値Xと信号値Yとの位相差 ϕ が90° になる点を求めればよいことになる。したがって、判定・ゲイン設定部39は、位相差の平均値が実質的に90°

でないときにはゲイン値を変更して、位相差の平均値が 実質的に90°になる点を検出して、実質的に90°に なる点における係数値Kをジャストフォーカスサーボの ためのループゲイン値として設定される値として記憶す ればよい。このときに、実質的に90°になる係数値K を検出する処理の仕方が従来と相違し、かけ算処理の係 数値Kを設定するときに上位 n ビット (n は 3 以上の整 数)を最初の判定基準として設定して次のゲイン値を選 択していく。これにより設定するゲインの変動幅を小さ くすることができる。このことによりサーボループの制 御はずれを抑制する効果がある。 【0014】図2は、図5の演算処理装置3に対応する演算処理装置10であって、前記の各機能ブロックの要素を実現する内部構成の説明図である。演算処理装置10は、MPU11とメモリ12、インタフェース13とが相互にバス14により接続されていて、メモリ12には、フォーカスサーボプログラム15と、外乱発生プログラム16、位相差測定プログラム17、平均値算出プログラム18、そして判定・ゲイン設定プログラム19等を有していて、フォーカスサーボパラメータ記憶領域20が設けられている。特に、この実施例の特徴は、位相差測定プログラム17における位相差算出処理が従来の図5のものと異なり、判定・ゲイン設定プログラム19におけるゲイン値設定の処理が従来の図5のものと異なる。以下これらの点を中心として詳細に説明する。

【0015】ここで、フォーカスサーボプログラム15 は、電源がONになってこのプログラムがMPU11に 実行されたときには、MPU11は、フォーカスサーボ ループのゲイン設定処理に入る。このゲイン設定処理と しては、外乱発生プログラム16をコールして実行し、 A/D2、インタフェース13を介して取込んだ位置エ ラー検出信号FEのデジタル値をメモリ12に記憶す る。そして外乱生成値Xを得て、これと記憶されている デジタル値Y(位置エラー検出信号FE)とを合成して 設定されているゲイン値に対応した係数値Kをかけてか け算処理をし、その結果に対して位置エラーを修正する **「方向にサーボフィルタ処理をしてインタフェース13を** 介してD/A4に出力する。その結果、D/A4を介し てピックアップユニット1のフォーカス位置調整機構1 b (レンズ移動機構) のドライブアンプに加える。な お、このフォーカスサーボプログラム15では、MPU 11の処理により図1の信号合成部31と、かけ算部3 3、そしてサーボフィルタ部34と実現する。

【0016】さらに、MPU11は、フォーカスサーボ プログラム15を実行して、位相差測定プログラム17 をコールしてこれをMPU11が実行して、A/D2、 インタフェース13を介して取込んだ位置エラー検出信 号FEについて、後述する式に従って得られるデジタル 値Yと外乱生成値Xについての位相差を算出する。ここ で、この位相差の測定値が所定数M (Mは2以上の整数 値、測定回数に対応)に達すると、フォーカスサーボプ ログラム15は、次に平均値算出プログラム18をコー ルしてMPU11に実行させ、M回測定の位相差の平均 値を算出させる。次にフォーカスサーボプログラム15 は、判定・ゲイン設定プログラム19をコールしてMP U11に実行させ、M回測定の平均値として算出された 位相差が実質的に90°であるか否かを判定させ、位相 差90°でないときに、次の係数値をかけ算部33の係 数値K(ゲイン値)として設定させて、再びフォーカス サーボループのゲイン設定処理に入り、判定・ゲイン設 定プログラム19による位相差の判定を繰り返す。この 繰り返し判定において、MPU11は、位相差が実質的に90°になったと判定結果を得たときには、そのときの係数値Kをゲイン値としてフォーカスサーボパラメータ記憶領域20に記憶する。

【0017】このような処理が終了した後に、MPU11は、例えば、プレイボタンが押されたときなど、光ディスクからデータを読出すとき、あるいはデータを書込むときになどにフォーカスサーボプログラム15を実行して、前記判定の結果求められた、フォーカスサーボパラメータ記憶領域20に記憶された位相差が実質的に90°になったときの係数値Kをゲイン値として読出してかけ算部33のゲイン値として設定してフォーカスサーボ処理を行う。これによりビックアップユニット1を最下点あるいは最上点から合焦位置へと移動させて位置エラー検出信号FEがゼロとなるように自動的に制御して光ディスクの照射面が合焦点位置になるようにピックアップユニット1のレーザ光の焦点を設定する処理をする。

【0018】外乱発生プログラム16は、このプログラムがMPU11に実行されたときに、所定の周波数に対応する波形信号をデジタル値の形で生成して、メモリ12の作業領域の所定位置に時間の関数としての波形値を順次記憶する。これのMPU11による実行により外乱信号発生部32の機能が実現する。位相差測定プログラム17は、このプログラムがMPU11に実行されたときに、外乱信号値Xと、合成信号値Nから信号値Yを算出し、さらに信号値Yと信号値Xとの位相差を算出してメモリ12に記憶する。これは、信号合成部38と位相差算出部34との機能を実現する。

【0019】平均値算出プログラム18は、このプログ ラムがMPU11に実行されたときに、算出された位相 差の算出結果がM回分になるか否かを判定して、M回分 になった時点で位相差の算出結果の平均値を算出する。 これは、平均値算出部36の機能を実現する。判定・ゲ イン設定プログラム19は、このプログラムがMPU1 1に実行されたときに、位相差の算出結果の平均値が実 質的に90°が否かを判定して、実質的に90°のとき にはフォーカスサーボパラメータ記憶領域20にそのと きの係数値Kをゲイン値として記憶する。そうでないと きに、図5に示すように、かけ算処理の係数値K(ゲイ ン値)を順次設定していく。この設定のときに上位nビ ット(nは3以上の整数)を最初の判定基準の開始点と して上位 n ビットに対して順次インクリメントあるいは ディクリメントして位相差の判定結果に対応する次のゲ イン値を選択して設定していく処理を行う。これは、判 定・ゲイン設定部39の機能を実現する。

【0020】図3は、フォーカスサーボプログラムのゲイン設定処理のフローチャートである。電源がONにされると、まず、ゲイン自動調整初期化処理を行う(ステップ101)。この初期化処理としては、ゲイン自動調

整中フラグをリセットし、ゲイン調整ビットカウンタをクリアし、カウンタに初期の係数値(あらからじ決められたゲイン値)をセットする。なお、カウンタとしてはメモリ12内に設けられたソフトカウンタが使用される。カウンタの係数値Kは、かけ算部33に与えられ、合成値Nにかけ合わされてサーボループ処理が行われる。次に、位相測定初期化処理を行う(ステップ102)。これは、位相差測定回数カウンタ(ソフトカウンタ)の値mをクリアし(m=0)、その他、測定に必要な各種のカウンタ、レジスタ領域をクリアする。

【0021】次に、外乱信号発生し、係数値Kをゲイン値としてサーボフィルタ処理をして(ステップ103)、位相差測定開始タイミングか否かを判定する、位相差測定開始待ちループに入る(ステップ104)。この位相差測定スタートタイミングは、例えば、フォーカスサーボループにおいて外乱信号の出力が開始された状態としてサーボフィルタ処理の結果値のデータにおけるMSBの値が"H"になるタイミングである。

【0022】次にピックアップユニット1からの採取デ ータを位置エラー検出信号値N・Gとしてメモリへ記憶 し(ステップ105)、そのときの外乱信号値Xのデー タをメモリへ記憶し(ステップ106)、前記の(1) 式、(2)式に従い、検出された位置エラー検出信号値N ・Gと外乱信号値Xとから合成値Nを算出して、検出さ れた信号値N・Gにより合成処理をして信号値Yを算出 してメモリへ記憶し(ステップ107)、信号値×、Y から位相差算出処理をして位相差φiをメモリへ記憶す る(ステップ108)。そして位相差測定終了タイミン グか否かを判定する、位相差測定終了待ちループに入る (ステップ109)。この位相差測定終了タイミング は、例えば、フォーカスサーボループにおいて外乱信号 値のデータにおけるMSBの値が"H"になるタイミン グである。そして測定回数m=m+1として更新して (ステップ110)、測定回数m>Mかの判定を行う (ステップ111)。Mは測定回数の設定値である。こ の判定でNOとなるとステップ103へと戻る。

【0023】ステップ111の判定においてYESとなると、M個の位相差φiから位相差の平均値φを算出してステップ112)、平均値φがφ 90°か?、の判定をする(ステップ113)。ここで、NOとなると、現在のかけ算の係数値K(ゲイン値)の上位3ビットを取得してステップ114)、90°に対して平均値φは+側か?、の判定をして(ステップ115)で、YESとなり、+側のときには、係数値Kの上位3ビットにー1を加えて係数値K(ゲイン)を算出して(ステップ116)、ステップ101に戻り、ここで算出された係数値K(ゲイン)を初期値に換えて設定して、次のステップ102で位相差測定回数カウンタの値mをクリアする。そしてステップ103からの前記の処理を繰り返す。

【0024】また、ステップ115の判定でNOとな り、+側でないときには、-側となるので、係数値Kの 上位3ビットに+1を加えて係数値K (ゲイン)を算出 して(ステップ116a)、ステップ101へと戻り、 ここで算出された係数値K(ゲイン)を設定して、次の ステップ102で位相差測定回数カウンタの値mをクリ アする。そしてステップ103からの前記の処理を繰り 返す。このようにして、ステップ113の判定でYES となると、そのときの係数値K(ゲイン値)がフォーカ スサーボパラメータ記憶領域20に記憶されて(ステッ プ117)、ここでの処理が終了する。この後は、MP U11は、フォーカスサーボプログラム15を実行して ピックアップユニット1に対してフォーカスサーボパラ メータ記憶領域20に記憶された係数値Kを用いて合成 された信号値Nに対してかけ算部33においてかけ算処 理をして従来と同様なフォーカス制御をする。

【0025】ここで、この実施例におけるステップ114からステップ116、116 aに至る係数値K(ループゲイン)の設定と、その変化について図4を用いて説明する。なお、係数値Kは、6ビット程度のデータ値を使用するとよいが、ここでの説明では、説明を簡単にするために係数値K(ゲイン値)のビット数を4ビットとして説明する。まず、ステップ101で設定された係数値Kの初期値が"1000"であるとする。これが図4のツリーの出発点となる。そして、ステップ115の判定でYESとなり、+側のときには、図4に示すように、ステップ116で上位3ビットの"100"に一1が加えられディクリメントされ、結果として係数値Kの値は、ツリーの右側の枝を辿り、"0110"となる。これがステップ101において次の係数値K(ゲイン値)としてかけ算部33に与えられる。

【0026】逆に、ステップ115の判定でNOとなり、一側のときには、図4に示すように、ステップ116aで上位3ビットの"100"に+1が加えられ、結果として係数値Kの値は、ツリーの左側の枝を辿り、

"1010"となって、これがステップ101において次の係数値K(ゲイン値)としてかけ算部33に与えられる。以降、図4に示すように、ステップ115の判定の都度、ここでNOとなったときには位相90°に対して一側であるので、そのときには1つ前の係数値Kに対して右側の枝を辿り、係数値Kの値が変化していき、YESのときには+側であるので1つ前の係数値Kに対して左側の枝を辿り、係数値Kの値が変化していく。この場合も前記の上位3ビットに対して判定結果に応じたインクリメントあるいはデクリメントを繰り返して、この上位3ビットの値を決定した後にこれ以下の下位のビットについて順次判定結果に応じてインクリメントあるいはデクリメントして平均値すがす。90°(実質的に位相差が90°となるすりに対応する係数値Kの値を決定するものである。

【0027】このように係数値Kを算出する基準ビットを上位のnビット(ただしnは3以上の整数)に着目してその値を基準として位相差の判定結果に応じてインクリメントあるいはデクリメントすることにより、上位nビット分についてこの上位の1/nビットの分解能で決定していき、その後にこれより下位のビット値を選択する。このことにより、上位nビット分についてこの上位の1/nビットの分解能としてゲイン調整の変動幅を小さくすることができる。これにより、ゲイン変動によるサーボループの外れ発生を抑制することが可能になる。

【0028】以上説明してきたが、実施例では、電源ON時にゲイン設定処理を行っているが、ここでのゲイン設定処理は、外部信号に応じてあるいは定期的に行うようにしてもよいことはもちろんである。また、実施例では、フォーカスサーボループを中心にして説明しているが、このサーボフィルタ処理を行うサーボループとしてトラッキングサーボ機構のサーボループも全く同様に使用されるので、この発明は、フォーカスサーボル機構の場合のサーボループに限定されるものではない。

[0029]

【発明の効果】この発明にあっては、N=X+DとY=N+Dとの2式(ただし、Dは、位置エラー検出信号の値)に従って得られる外乱信号の生成値Xと、前記の信号値Yの位相差を検出し、この位相差が実質的に90°になるゲイン値をループゲインとして設定すれば、サーボ処理のループゲインを実質的に0dBにしたい周波数の信号値Xの外乱信号を生成し、位相差が実質的に90°になるゲイン値を求めるだけで、そのときどきのピックアップユニットの特性に対応したサーボ処理におけるループゲインの設定が可能になる。その結果、ピックアップ

ユニットの特性に合わせて基準範囲を設定することがが不要になり、ピックアップユニットの特性に影響されることなく、レーザ光の位置をサーボ処理で修正してレーザ光を照射面に焦点合わせをすることも、あるいはトラッキングさせることも容易にできる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、この発明の光ディスク再生装置を適用した光ディスク再生装置のフォーカスサーボループゲイン調整におけるコントローラの内部の機能ブロック図である。

【図2】図2は、図1のフォーカスサーボループゲイン 調整を行うコントローラの説明図である。

【図3】図3は、ゲイン設定処理のフローチャートである。

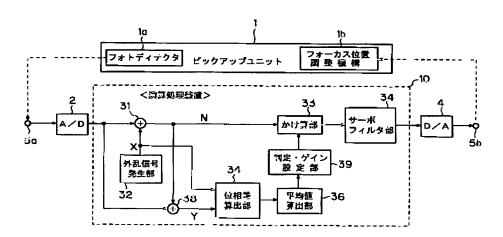
【図4】図4は、ゲイン設定処理におけるゲイン値選択 の説明図である。

【図5】図5は、従来のフォーカスサーボループゲイン 調整におけるコントローラの内部処理を機能ブロック化 した説明図である。

【符号の説明】

1…ピックアップユニット、1 a…フォトディテクタ、1 b…ピックアップユニットのフォーカス位置調整機構、2…A/D変換回路(A/D)、3、10…演算処理装置、4…D/A変換回路、31…信号合成部、32…外乱信号発生部32、33…かけ算部、34…サーボフィルタ部、11…MPU、12…メモリ、13…インタフェース、14…バス、15…フォーカスサーボプログラム、16…外乱発生プログラム、17…位相差測定プログラム、18…平均値算出プログラム、19…判定・ゲイン設定プログラム、20…フォーカスサーボパラメータ記憶領域。

【図1】



i

1

